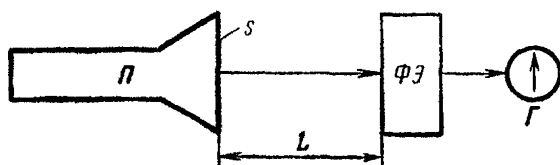


<p align="center">СССР</p> <p align="center">—</p> <p>Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР</p>	<p align="center">ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ</p>	<p align="center">ГОСТ 12491—67*</p>
	<p align="center">ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОННО- ЛУЧЕВЫЕ ПРИЕМНЫЕ</p> <p align="center">Метод измерения яркости свечения экранов</p> <p align="center">Cathod-ray tubes for reception. Method of measurement of screen brilliancy</p>	
		<p align="center">Группа Э29</p>

1. Настоящий стандарт распространяется на приемные электронно-лучевые приборы (ЭЛП) и устанавливает метод измерения яркости свечения экранов с погрешностью, не превышающей $\pm 10\%$.

Данный метод может быть использован также при измерении локальной яркости свечения экрана ЭЛП.

2. Блок-схема испытательной установки для измерения яркости свечения экрана должна соответствовать указанной на чертеже.



П — электронно-лучевой прибор; S — площадь растра; L — расстояние между растром и светочувствительной поверхностью фотоэлемента; ФЭ — селеновый фотоэлемент, спектральная чувствительность которого должна соответствовать ГОСТ 11093—64; Г — гальванометр.

3. Погрешность коррекции спектральной чувствительности фотоэлемента под кривую видности (ГОСТ 11093—64) не должна превышать $\pm 5\%$.

4. Отклонение от линейности световой характеристики фотоэлемента при максимальном мгновенном значении яркости пульсирующего светового потока растра или его участка не должно превышать $\pm 3\%$.

5. Погрешность градуировки селенового фотоэлемента по освещенности не должна превышать $\pm 5\%$.

6. Центры ЭЛП и фотсэлемента должны находиться на одной оси. Смещение центров от оси не должно превышать $\pm 5\%$ от расстояния между центрами растра и светочувствительной поверхности фотоэлемента.

<p>Внесен Министерством электронной промышленности</p>	<p>Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 3/1 1967 г.</p>	<p>Срок введения 1/1 1968 г.</p>
--	---	--------------------------------------

7. Расстояние между растром и светочувствительной поверхностью фотоэлемента L должно составлять не менее 5—7 диагоналей раstra.

Погрешность измерения L не должна превышать $\pm 1\%$.

Допускается проведение измерений при L , меньших 5 диагоналей раstra, при условии применения специальных устройств, компенсирующих возникающую при этом погрешность.

8. Величина засветки экрана от внешних и внутренних источников света не должна превышать 2,5% яркости свечения раstra. Для устранения засветок от внешних источников света должны использоваться светонепроницаемые тубусы, удовлетворяющие требованиям п. 7.

9. Измерение яркости должно производиться при оптимальной фокусировке, которая устанавливается по минимальному току фотоэлемента.

10. Нелинейность разверток раstra по строке и кадру на испытательной установке не должна превышать 10%.

При измерении яркости всего экрана допускается нелинейность разверток раstra по строке и кадру не более 25%.

(Измененная редакция—«Информ. указатель стандартов» № 8 1968 г.).

11. Погрешность установки размеров раstra не должна превышать $\pm 2\%$.

12. Электрический режим, размеры раstra и режим разложения при измерении яркости свечения экрана должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на отдельные типы ЭЛП.

13. Время разогрева ЭЛП должно быть в пределах 3—5 мин.

14. Яркость свечения экранов ЭЛП (B) в нитах определяется отношением силы света, излучаемого поверхностью раstra в направлении оси ЭЛП, к площади этой поверхности и должна вычисляться по формуле:

$$B = \frac{EL^2}{S},$$

где:

E — освещенность в лк;

L — расстояние в м;

S — площадь раstra в м².